

★信頼性研究会 (R)

専門委員長 土肥 正 副委員長 門田 靖

幹事 岡村寛之・井上真二 幹事補佐 横川慎二・吉川隆英・作村建紀

★機構デバイス研究会 (EMD)

専門委員長 萱野良樹

幹事 上野貴博 幹事補佐 林 優一・宮永和明

日時 2月10日(木) 14:00~16:25

会場 オンライン開催

議題 機構デバイスの信頼性, 信頼性一般

1. [招待講演] 電気接点デバイス特有の故障モードと対策の考察 森井真喜人(オムロン)
2. 平板状10ターンコイルによるAl/Cu薄板の電磁圧接 相沢友勝(都立高専)
3. 電気接点間に吹き付ける空気の流速と開離時アークに対するその影響の数値計算による検討
○奥野貴成・関川純哉(静岡大)
4. 48VDC/300A回路内で等速開離装置を用いて磁気吹き消しされる開離時アーク
○矢崎晴子・関川純哉(静岡大)

◆日本信頼性学会, IEEE Reliability Society Japan Chapter 共催

☆R研究会

【問合先】

井上真二(関西大)

E-mail: ino@kansai-u.ac.jp

☆EMD研究会

【問合先】

和田真一(TMC)

TEL [044] 555-6171, FAX [044] 211-4200

E-mail: s-wada@tmcsystem.co.jp

萱野良樹(電通大)

TEL & FAX [042] 443-5233

E-mail: ykayano@uec.ac.jp

水上雅人(室蘭工大)

TEL & FAX [0143] 46-5307

E-mail: m-mizukami@mmm.muroran-it.ac.jp

鈴木健司(富士電機機器制御)

TEL [048] 547-1037, FAX [048] 549-1825

E-mail: suzuki-knj@fujielectric.com

林 優一(奈良先端大)

TEL [0743] 72-5390, FAX [0743] 72-5391

E-mail: yu-ichi@is.naist.jp

©EMD研究会に関する最新の情報は, <http://www.ieice.org/es/emd/jpn/>を御参照下さい.